

Domaine : Chimie - **Thématique(s) :** Chimie analytique, physique et théorique
STAGES COURTS

INITIATION AUX MICROSCOPIES À CHAMP PROCHE : AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPE) ET STM (SCANNING TUNNELLING MICROSCOPY)

Au début des années 80, l'invention du microscope à effet tunnel (STM) a ouvert la voie à de nombreuses techniques expérimentales de caractérisation des surfaces à l'échelle du nanomètre comme la microscopie à force atomique (AFM) ainsi que la microscopie à champ proche optique (SNOM) ... Dans le domaine des nanosciences, les microscopies à sonde locales tiennent une place importante. Le principe à la base de ces techniques consiste à placer une sonde effilée à proximité d'une surface où se trouvent les objets étudiés. Dans le cas de l'AFM, c'est la force entre la pointe et la surface qui est sondée alors que c'est le courant tunnel qui est sondé dans le cas de microscopie à effet tunnel (STM). Ces dispositifs expérimentaux sont des outils de caractérisation pour l'imagerie à l'échelle atomique, mais aussi pour la manipulation d'atomes ou de molécules.

🕒 **Durée de la formation :** 14 heures

📅 **Dates :** Voir le calendrier

📍 **Lieu :** Campus Pierre et Marie Curie – Paris (Jussieu)

💶 **Tarif :** 1200 €

Modalité : Présentiel

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Cette formation, à la fois théorique et pratique, a pour but de comprendre les principes de fonctionnement de l'AFM et du STM.

Elle a aussi vocation à sensibiliser à l'interprétation des mesures (images, courbes de force, courbes I(V)...) et aux limitations des instruments. Il s'agira donc d'aboutir à une utilisation rationnelle du matériel tout en sachant exploiter les données expérimentales et reconnaître les artefacts de mesure.

PUBLIC VISÉ

Chercheur, ingénieur et toute personne cherchant à acquérir des connaissances de base dans la caractérisation des matériaux en physique, chimie et biologie

PRÉ-REQUIS :

Minimum Bac + 2 en chimie ou chimie-physique

PROGRAMME

Jour 1 matin :

Cours AFM : principes fondamentaux de l'AFM

Jour 1 après-midi :

TP1 AFM : Comprendre le fonctionnement d'un CDROM

TP2 AFM : Cristaux de nanocristaux : introduction à la nanoindentation

Jour 2 matin :

Cours STM : principes fondamentaux du STM

Visites de différents bûts expérimentaux sous ultravide

Jour 2 après-midi :

TP1 STM : Imagerie à l'échelle atomique – HOPG (Highly oriented pyrolytic

INFORMATIONS

Catégorie de l'action de développement des compétences :

(Article L6353-1 du Code du Travail)

Action de formation

Effectifs : Min 3 personnes/Max 6 personnes

Documents : Supports de cours

Évaluation et validation :

Attestation de fin de formation

Possibilité de sessions sur-mesure

CONTACT

✉ chimie-fc@sorbonne-universite.fr

graphite)

TP2 STM : Tamis moléculaire – STM à l'interface liquide-solide

MÉTHODES

A l'issue de la formation : le stagiaire sera capable de comprendre les principes de fonctionnement des microscopes à sonde locale AFM et STM.

DEBOUCHES :

Cette formation permet aux individus de sécuriser leur parcours professionnel en leur donnant les compétences nécessaires pour accompagner les entreprises dans les enjeux liés à leur secteur d'activité et s'adapter aux évolutions technologiques associées.

LES + DE LA FORMATION

La formation, qui alternera cours et de travaux pratiques, sera assurée par un ingénieur spécialiste du domaine. De plus, elle sera supportée par l'utilisation à la fois d'un dispositif pédagogique et d'un dispositif dédié à la recherche. Enfin, une formation à la carte est tout à fait possible, pour cela, nous consulter.
